



Centro UC
Investigación en Nanotecnología
y Materiales Avanzados - CIEN



Concurso de Micrografía Electrónica CIEN-UC

La microscopía electrónica de barrido es una herramienta que permite visualizar estructuras y superficies que son imperceptibles a nuestros ojos. Esta técnica nos permite adentrarnos en un mundo escondido, donde las formas, texturas y patrones presentan una diversidad inimaginable. En este mundo microscópico podemos encontrar cuevas de cristales, bosques de nanoestructuras o enjambres de microorganismos en la cabeza de un alfiler. El Centro de Nanotecnología y Materiales Avanzados de la Universidad Católica (CIEN-UC) ha lanzado la primera convocatoria del "Concurso de micrografía electrónica CIEN-UC" con el fin de premiar las imágenes más impresionantes que se han obtenido con esta técnica.

Objetivos:

- Divulgar el trabajo científico mediante el uso del microscopio electrónico como instrumento de caracterización.
- Fomentar la creatividad y la originalidad en la preparación de muestras, reconociendo el trabajo de investigadores científicos.
- Incentivar la interpretación e intervención artística de las imágenes obtenidas por microscopía.

Bases del concurso

Tema: Las imágenes presentadas deben haber sido obtenidas con el microscopio FESEM Quanta 250 FEG del CIEN-UC entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, y deben corresponder a muestras utilizadas en proyectos de investigación científica. Se pueden presentar imágenes que hayan participado en otros concursos o que hayan sido publicadas en revistas científicas, prensa, redes sociales u otros medios de comunicación.

www.uc.cl



Centro UC
Investigación en Nanotecnología
y Materiales Avanzados - CIEN



Concursantes: El concurso está dirigido a todos los usuarios y clientes (personas naturales) vinculados a alguna institución pública o privada. Cada concursante podrá presentar hasta tres imágenes correspondientes a muestras distintas y deberá asegurarse de cumplir con todas las bases y requisitos del concurso para su participación.

Postulación: Para postular al concurso, es necesario completar el formulario con todos los campos obligatorios y adjuntar la imagen a participar en el siguiente enlace: [FORMULARIO](#). El formulario solicita información personal, datos profesionales, detalles de la muestra, información relacionada con la investigación y una breve descripción de la imagen que la contextualice dentro del estudio. Además, se permite la opción de acompañar la imagen principal con dos imágenes adicionales que ayuden a comprender la interpretación.

Presentación de la imagen: Las imágenes deben ser enviadas en formato digital a través del formulario en formato TIFF, JPG, PNG o BMP. Se permite la edición digital y el coloreado de las imágenes con propósitos artísticos. En caso de realizar ediciones, se debe además adjuntar en la postulación la imagen original conteniendo la barra de información ubicada en la parte inferior, la cual indica la fecha y hora de adquisición, el voltaje utilizado, la magnificación, el detector utilizado y la barra de escala. Además, debe tener una resolución mínima de 700x500 píxeles y un peso máximo de 30 MB.

Propiedad: Los participantes garantizan que cumplen uno de los siguientes requisitos:

1. Participar activamente de la investigación para la cual se fabricó la muestra y contar con autorización explícita del investigador principal para participar.
2. Ser el investigador principal de la investigación respectiva y haber costeado el valor del servicio.

Fecha límite: La fecha límite para el envío de las imágenes es el sábado 15 de julio del 2023.

www.uc.cl



Selección: El encargado de servicios del CIEN-UC verificará la admisibilidad de las postulaciones, asegurándose del cumplimiento de las bases del concurso, incluyendo los plazos, formatos y entrega de toda la información solicitada. El jurado estará compuesto por el directorio del CIEN-UC (director y directores de investigación) y un/a académico/a de la Facultad de Artes UC.

Criterios de evaluación:

- Composición artística: Originalidad y distribución de los elementos observados.
- Dimensiones de las estructuras observadas.
- Nivel de relación con nanotecnología y materiales avanzados.
- Interpretación artística.
- Originalidad y complejidad de la preparación de la muestra.
- Coherencia entre proyecto de investigación y muestra estudiada.
- Completitud de la información solicitada respecto a la imagen, la investigación y la muestra.

Premios: El primer lugar recibirá un premio de \$150.000. El segundo lugar recibirá un premio de \$100.000 y los siguientes 3 lugares recibirán \$50.000 cada uno. Los premios serán entregados durante los 30 días siguientes al anuncio de los ganadores mediante la entrega de una Gift Card con el monto equivalente.

Resultado: Los resultados estarán disponibles 30 días después del cierre de las postulaciones. Estos serán informados a los correos de contacto que hayan proporcionado y en los medios de difusión del CIEN-UC.

Permiso de divulgación de las imágenes: Al presentar la postulación, los participantes otorgan al CIEN-UC el permiso de utilizar las imágenes y la información relacionada a las muestras y a la investigación con fines de divulgación, siempre otorgando el crédito correspondiente a los propietarios de las muestras e investigaciones.

Contacto: En caso de dudas o consultas, puede contactarse al correo electrónico fesemcien@uc.cl o al teléfono 569-5504-1441.